

## REFERENCES

1. T. Mikolajick, S. Slesazeck, M. H. Park, & U. Schroeder, MRS Bulletin 43, 340-346 (2018).
2. T. S. Böске, J. Müller, D. Bräuhaus, U. Schröder, & U. Böttger, Applied Physics Letters 99, 102903 (2011).
3. M. H. Park, Y. H. Lee, T. Mikolajick, U. Schroeder, & C. S. Hwang, MRS Communications 8, 795-808 (2018).
4. A. I. Khan, K. Chatterjee, B. Wang, S. Drapcho, L. You, C. Serrao, S. R. Bakaul, R. Ramesh, & S. Salahuddin, Nature materials 14, 182-186 (2015).
5. M. Jerry, P. Y. Chen, J. Zhang, P. Sharma, K. Ni, S. Yu, & S. Datta, In Electron Devices Meeting (IEDM), IEEE International, 6-2, (2017, December).
6. V. Mukundan et al. Manuscript in Preparation (2019).